



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20120418002
2012 年 4 月 19 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタムドキュメント
マネージャ 牧 達郎 (牧)

HPA CBC10 プロセス 一部製品 前処理サイト変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

既にご存知のように、6 インチウェーハ前処理サイト、弊社日出工場及びヒューストン工場の閉鎖について、本年 1 月に報告させていただきました。本移行対象製品に関する変更通知は、今後数週間に渡り、プロセステクノロジー毎に段階的に行われます。本変更通知は、代替前処理サイトへの CBC10 プロセス対象製品移行に関する連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30 日**以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、30 日以内にご連絡が無い場合には、本変更をご承認いただけたものと判断させていただきます。変更品評価用サンプルもしくは追加データご入用の場合には、現行前処理サイト閉鎖までに新前処理サイト製品のご評価を完了いただけますように、本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90 日**以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではありません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはありません。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)	☒ Final notice		
変更概要	Design/Specification	☐ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	☒ Wafer Fab	☒ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Assembly	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling	☐ -	
変更内容	HPA CBC10プロセス 一部製品 前処理サイト変更 現行 : TI-HFAB (Houston, 米国) 変更後 : TI-SFAB (Sherman, 米国)			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	2013 年 4 月の出荷より予定しています。 (サンプルは 2013 年 3 月の出荷より予定しています。)			
品質認定試験	☒ 計画	☐ 終了		
製品表示	☐ 変更無し	☒ 変更あり		
備考	-			

変更内容

内容 : 弊社 HPA (ハイパフォーマンスアナログ) CBC10プロセス 一部製品の前処理サイトについて、
 現行 TI-HFAB (Houston, 米国) サイトにおいて製造していますが、TI-HFAB サイト閉鎖による供給能力
 確保の為に、これに替えて、TI-SFAB (Sherman, 米国) サイトに変更します。尚、今回の変更で、製品
 についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容

CBC10プロセス前処理サイト

ウェーハ径

現行

TI-HFAB (米国)

150 mm

変更後

TI-SFAB (Sherman, 米国)

150 mm

理由 : TI-HFAB サイト閉鎖による供給能力確保の為

対象製品リスト

対象製品名				
BUF602ID	OPA2691IDR	OPA3832ID	OPA690IDR	OPA846IDBVT
BUF602IDBVR	OPA2691IDRG4	OPA3832IDG4	OPA690IDRG4	OPA846IDBVTG4
BUF602IDBVRG4	OPA2694ID	OPA3832IDR	OPA691ID	OPA846IDG4
BUF602IDBVT	OPA2694IDG4	OPA3832IDRG4	OPA691IDBVR	OPA846IDR
BUF602IDBVTG4	OPA2694IDR	OPA3832IPW	OPA691IDBVRG4	OPA846IDRG4
BUF602IDG4	OPA2694IDRG4	OPA3832IPWG4	OPA691IDBVT	OPA847ID
BUF602IDR	OPA2695ID	OPA3832IPWR	OPA691IDBVTG4	OPA847IDBVR
BUF602IDRG4	OPA2695IDG4	OPA3832IPWRG4	OPA691IDG4	OPA847IDBVRG4
HPA000881-14D	OPA2695IDR	OPA3875IDBQ	OPA691IDR	OPA847IDBVT
HPA000881-14DR	OPA2695IDRG4	OPA3875IDBQG4	OPA691IDRG4	OPA847IDBVTG4
HPA00184U/2K5	OPA2695IRGTR	OPA3875IDBQR	OPA692ID	OPA847IDG4
HPA00814IDGKR	OPA2695IRGTRG4	OPA3875IDBQRG4	OPA692IDBVR	OPA847IDR
LOG114AIRGVR	OPA2695IRGTT	OPA4684ID	OPA692IDBVRG4	OPA847IDRG4
LOG114AIRGVRG4	OPA2695IRGTTG4	OPA4684IDG4	OPA692IDBVT	OPA860ID
LOG114AIRGVT	OPA2822E/250	OPA4684IDR	OPA692IDBVTG4	OPA860IDG4
LOG114AIRGVTG4	OPA2822E/250G4	OPA4684IDRG4	OPA692IDG4	OPA860IDR
MP1OPA4684-W	OPA2822E/2K5	OPA4684IPWT	OPA692IDR	OPA860IDRG4
MP1OPA656-W	OPA2822E/2K5G4	OPA4684IPWTG4	OPA692IDRG4	OPA861ID
MP1OPA699-W	OPA2822U	OPA4684MJD	OPA693ID	OPA861IDBVR
MP1OPA842-W	OPA2822U/2K5	OPA4820ID	OPA693IDBVR	OPA861IDBVRG4

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

MP10PA847-W	OPA2822U/2K5G4	OPA4820IDG4	OPA693IDBVRG4	OPA861IDBVT
MPA4609IPFBR	OPA2822UG4	OPA4820IDR	OPA693IDBVT	OPA861IDBVTG4
MPA4609IPFBRG4	OPA2830ID	OPA4820IDRG4	OPA693IDBVTG4	OPA861IDG4
MPA4609IPFBT	OPA2830IDG4	OPA4820IPWR	OPA693IDG4	OPA861IDR
MPA4609IPFBTG4	OPA2830IDGKR	OPA4820IPWRG4	OPA694ID	OPA861IDRG4
OPA2613ID	OPA2830IDGKRG4	OPA4820IPWT	OPA694IDBVR	OPA875ID
OPA2613IDG4	OPA2830IDGKT	OPA4820IPWTG4	OPA694IDBVRG4	OPA875IDG4
OPA2613IDR	OPA2830IDGKTG4	OPA4830IPW	OPA694IDBVT	OPA875IDGKR
OPA2613IDRG4	OPA2830IDR	OPA4830IPWG4	OPA694IDBVTG4	OPA875IDGKRG4
OPA2614ID	OPA2830IDRG4	OPA4830IPWR	OPA694IDG4	OPA875IDGKT
OPA2614IDG4	OPA2832ID	OPA4830IPWRG4	OPA694IDR	OPA875IDGKTG4
OPA2614IDR	OPA2832IDG4	OPA4872ID	OPA694IDRG4	OPA875IDR
OPA2614IDRG4	OPA2832IDGKR	OPA4872IDG4	OPA695ID	OPA875IDRG4
OPA2652E/250	OPA2832IDGKRG4	OPA4872IDR	OPA695IDBVR	OPA890ID
OPA2652E/250G4	OPA2832IDGKT	OPA4872IDRG4	OPA695IDBVRG4	OPA890IDBVR
OPA2652E/3K	OPA2832IDGKTG4	OPA615ID	OPA695IDBVT	OPA890IDBVRG4
OPA2652E/3KG4	OPA2832IDR	OPA615IDG4	OPA695IDBVTG4	OPA890IDBVT
OPA2652U	OPA2832IDRG4	OPA615IDGSR	OPA695IDG4	OPA890IDBVTG4
OPA2652U/2K5	OPA2846ID	OPA615IDGSRG4	OPA695IDGKR	OPA890IDG4
OPA2652U/2K5G4	OPA2846IDG4	OPA615IDGST	OPA695IDGKT	OPA890IDR
OPA2652UG4	OPA2846IDR	OPA615IDGSTG4	OPA695IDR	OPA890IDRG4
OPA2670IRGVR	OPA2846IDRG4	OPA615IDR	OPA695IDRG4	REF1112AIDBZR
OPA2670IRGVT	OPA2889ID	OPA615IDRG4	OPA698ID	REF1112AIDBZRG4
OPA2673IRGVR	OPA2889IDG4	OPA653IDBVR	OPA698IDG4	REF1112AIDBZT
OPA2673IRGVRG4	OPA2889IDGSR	OPA653IDBVT	OPA698IDR	REF1112AIDBZTG4
OPA2673IRGVT	OPA2889IDGSRG4	OPA653IDRBR	OPA698IDRG4	SN200510075DR
OPA2673IRGVTG4	OPA2889IDGST	OPA653IDRBT	OPA698MJD	SN200510075DRG4
OPA2674I-14D	OPA2889IDGSTG4	OPA656N/250	OPA699ID	SN200609046DGSR
OPA2674I-14DG4	OPA2889IDR	OPA656N/250G4	OPA699IDG4	SN200609046DGSRG4
OPA2674I-14DR	OPA2889IDRG4	OPA656NB/250	OPA699IDR	SN200612054DGSR
OPA2674I-14DRG4	OPA2890ID	OPA656NB/250G4	OPA699IDRG4	SN200612054DGSRG4
OPA2674ID	OPA2890IDG4	OPA656TDB1	OPA699MJD	VCA810AID
OPA2674IDG4	OPA2890IDGSR	OPA656TDB2	OPA820ID	VCA810AIDG4
OPA2674IDR	OPA2890IDGSRG4	OPA656U	OPA820IDBVR	VCA810AIDR
OPA2674IDRG4	OPA2890IDGST	OPA656U/2K5	OPA820IDBVRG4	VCA810AIDRG4
OPA2677IDDA	OPA2890IDGSTG4	OPA656U/2K5G4	OPA820IDBVT	VCA810ID
OPA2677IDDAG4	OPA2890IDR	OPA656UB	OPA820IDBVTG4	VCA810IDG4
OPA2677IDDAR	OPA2890IDRG4	OPA656UB/2K5	OPA820IDG4	VCA810IDR
OPA2677IDDARG4	OPA3684ID	OPA656UBG4	OPA820IDR	VCA810IDRG4
OPA2677IRGVR	OPA3684IDBQT	OPA656UG4	OPA820IDRG4	VCA820ID
OPA2677IRGVRG4	OPA3684IDBQTG4	OPA657N/250	OPA820SKGD1	VCA820IDG4
OPA2677IRGVT	OPA3684IDG4	OPA657N/250G4	OPA820SKGD3	VCA820IDGSR
OPA2677IRGVTG4	OPA3684IDR	OPA657NB/250	OPA830ID	VCA820IDGSRG4
OPA2677U	OPA3684IDRG4	OPA657NB/250G4	OPA830IDBVR	VCA820IDGST
OPA2677U/2K5	OPA3690ID	OPA657U	OPA830IDBVRG4	VCA820IDGSTG4
OPA2677U/2K5G4	OPA3690IDBQR	OPA657U/2K5	OPA830IDBVT	VCA820IDR
OPA2677UG4	OPA3690IDBQRG4	OPA657U/2K5G4	OPA830IDBVTG4	VCA820IDRG4
OPA2683ID	OPA3690IDBQT	OPA657UB	OPA830IDG4	VCA821ID
OPA2683IDCNR	OPA3690IDBQTG4	OPA657UBG4	OPA830IDR	VCA821IDG4
OPA2683IDCNRG4	OPA3690IDG4	OPA657UG4	OPA830IDRG4	VCA821IDGSR
OPA2683IDCNT	OPA3690IDR	OPA659IDBVR	OPA830-W	VCA821IDGSRG4
OPA2683IDG4	OPA3690IDRG4	OPA659IDBVT	OPA832ID	VCA821IDGST
OPA2683IDGSR	OPA3691ID	OPA659IDRBR	OPA832IDBVR	VCA821IDGSTG4
OPA2683IDGSRG4	OPA3691IDBQR	OPA659IDRBT	OPA832IDBVRG4	VCA821IDR
OPA2683IDGST	OPA3691IDBQRG4	OPA683ID	OPA832IDBVT	VCA821IDRG4
OPA2683IDGSTG4	OPA3691IDBQT	OPA683IDBVR	OPA832IDBVTG4	VCA822ID

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

OPA2684ID	OPA3691IDBQTG4	OPA683IDBVRG4	OPA832IDG4	VCA822IDG4
OPA2684IDCNT	OPA3691IDG4	OPA683IDBVT	OPA842ID	VCA822IDGSR
OPA2684IDCNTG4	OPA3691IDR	OPA683IDBVTG4	OPA842IDBVR	VCA822IDGSRG4
OPA2684IDG4	OPA3691IDRG4	OPA683IDG4	OPA842IDBVRG4	VCA822IDGST
OPA2684IDR	OPA3692ID	OPA683IDR	OPA842IDBVT	VCA822IDGSTG4
OPA2684IDRG4	OPA3692IDBQR	OPA683IDRG4	OPA842IDBVTG4	VCA822IDR
OPA2690I-14D	OPA3692IDBQRG4	OPA684ID	OPA842IDG4	VCA822IDRG4
OPA2690I-14DG4	OPA3692IDBQT	OPA684IDBVR	OPA842IDR	VCA824ID
OPA2690I-14DR	OPA3692IDBQTG4	OPA684IDBVRG4	OPA842IDRG4	VCA824IDG4
OPA2690I-14DRG4	OPA3692IDG4	OPA684IDBVT	OPA843ID	VCA824IDGSR
OPA2690ID	OPA3692IDR	OPA684IDBVTG4	OPA843IDBVR	VCA824IDGSRG4
OPA2690IDG4	OPA3692IDRG4	OPA684IDG4	OPA843IDBVRG4	VCA824IDGST
OPA2690IDR	OPA3693IDBQ	OPA684IDR	OPA843IDBVT	VCA824IDGSTG4
OPA2690IDRG4	OPA3693IDBQG4	OPA684IDRG4	OPA843IDBVTG4	VCA824IDR
OPA2691I-14D	OPA3693IDBQR	OPA690ID	OPA843IDG4	VCA824IDRG4
OPA2691I-14DG4	OPA3693IDBQRG4	OPA690IDBVR	OPA843IDR	XOPA820YS
OPA2691I-14DR	OPA3695IDBQ	OPA690IDBVRG4	OPA843IDRG4	
OPA2691I-14DRG4	OPA3695IDBQG4	OPA690IDBVT	OPA846ID	
OPA2691ID	OPA3695IDBQR	OPA690IDBVTG4	OPA846IDBVR	
OPA2691IDG4	OPA3695IDBQRG4	OPA690IDG4	OPA846IDBVRG4	

製品表示

この変更に伴い、出荷ラベルに記載の前処理サイト・生産国記号(ラベルの"20L/21L"の箇所)及びラベル上の表示位置は下記のようになります。

	現行	変更後
Fab Site: 前処理サイト	TI-HFAB	TI-SFAB
CSO (20L): 前処理サイト記号	HOU	SHE
CCO (21L): 生産国記号	USA	USA



図1 出荷ラベルの例

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2013 年 3 月	終了	2013 年 4 月末
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	LOG114AIRGV	-	-	
Wafer Fab Site:	SFAB	Fab Process:	CBC10	
Wafer Diameter(mm):	150	Metalization:	3.11kATiW/7.6 kAAICu0.5%/1kATiW	
MSL:	JEDEC L-2/260C	Passivation:	8.6kASiON/3.1 kASiN	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size	
Electrical Characterization	Over Temp		30	
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification		per spec	

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2013 年 3 月	終了	2013 年 4 月末
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	OPA2673IRGV	-	-	
Wafer Fab Site:	SFAB	Fab Process:	CBC10	
Wafer Diameter(mm):	150	Metalization:	3.11kATiW/7.6 kA AlCu0.5%/1kATiW	
MSL:	JEDEC L-2/260C	Passivation:	10kASiOn	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size	
HTOL High Temp Op Life	125C, 1000 Hrs		77	
Electrical Characterization	Over Temp		30	
ESD MM	50V		3	
ESD CDM	250V		3	
ESD HBM	1000V		3	
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification		per spec	
AC/DC Bench Test Characterization	Device specific AC &/or DC Char per PE team		5	

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2013 年 3 月	終了	2013 年 4 月末
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	OPA4872ID	-	-	
Wafer Fab Site:	SFAB	Fab Process:	CBC10	
Wafer Diameter(mm):	150	Metalization:	3.11kATiW/7.6 kA AlCu0.5%/1kATiW	
MSL:	JEDEC L-2/260C	Passivation:	8.6kASiON/3.1 kASiN (oxynitride/nitride)	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration			Sample Size
HTOL High Temp Op Life	125C, 1000 Hrs			77
Electrical Characterization	Over Temp			30
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs			77
Unbiased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs			77
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc			77
ESD CDM	500V			3
Die Level Destructive Physical Analysis	Unstressed			5
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification			per spec
Manufacturability (Wafer Fab)	per mfg. Site specification			per spec
Note: ** Preconditioning: JEDEC L-2/260C				

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2013 年 3 月	終了	2013 年 4 月末
信頼性試験 – 試料構成詳細				
Qual Device:	OPA656UB		OPA890ID	
Wafer Fab Site:	SFAB		SFAB	
Fab Process:	CBC10		CBC10	
Wafer Diameter(mm):	150		150	
Passivation:	10 KA SiOn		8.6kASiON/3.1 kASiN	
Metalization:	0.25kATiW/1kATiW/0.3kATiW/7.5kAAICu 0.5%/0.5kATiW		3.11kATiW/7.6 kA AlCu0.5%/1kATiW	
MSL:	JEDEC L-3/260C		JEDEC L-2/260C	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		OPA656UB	OPA890ID	
HTOL High Temp Op Life	125C, 1000 Hrs	77	77	
Electrical Characterization	Over Temp	30	30	
**High Temp. Storage Bake	150C, 500 Hrs	77	77	
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77	77	
**Unbiased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77	77	
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77	77	
ESD MM	50V	3	-	
ESD CDM	500V	3	3	
ESD HBM	1000V	-	3	
	2000V	3	-	
Destructive Physical Analysis	Pre-Stress	5	5	
Latch-up	JESD78	6	6	
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	per spec	per spec	
Manufacturability (Wafer Fab)	per mfg. Site specification	per spec	-	
AC/DC Bench Test Char.	Device spec AC &/or DC Char per PE team	5	-	
Note: ** Preconditioning: JEDEC L-3/260C				